Рис.1. Микрофотография ПЭМ измельченного НВУ, полученная на микроскопе JEM-2010 (JEOL)

Fig. 1. TEM micrographs of grinded NFC obtained using JEM-2010 (JEOL) microscope

Рис. 2. Изменение свободной энергии реакции (1) при различных значениях давления СО

Fig. 2. The change in free-energy of the reaction (1) at various CO pressure values

Рис.3. Дифрактограммы образцов

Fig. 3. XRD patterns of the samples

Рис.4. Снимки СЭМ образцов: (a) – #1-1200, (b) – #2-1400, (c) – #3-1500, (d) – #4-1600

Fig. 4. SEM images of the samples: (a) – #1-1200, (b) – #2-1400, (c) – #3-1500, (d) – #4-1600

Рис.5. Распределение частиц по размерам (гистограммы) образцов: #3-1500 (а) и #4-1600 (b)

Fig. 5. Particle size distribution (histograms) for samples: #3-1500 (а) and #4-1600 (b)

Рис.6. Кривые ТГ/ДСК образца #3-1500

Fig. 6. TG/DSC curves for sample #3-1500